

Day1 2022年12月6日 (火) 9:30-11:55 General トラック

Start Time	Title	Presenter
9:30	General トラック 開会	
9:35	主催者挨拶	鶴川 久
9:55	半導体デバイスおよびテストのトレンドとテラダインの新製品ロードマップ	穂園 和郎
10:40	休憩	
10:45	DUTのHSIOプロトコルを活用したSCANテスト	竹内 誠人
11:15	休憩	
11:20	DIBダイアグ：製品の円滑な量産立ち上げと、生産効率向上のサポート	蒲池 周一
11:50	General トラック 閉会	

Day2 2022年12月7日 (水) 9:00-11:25 UltraFLEX & x750 トラック

Start Time	Title	Platform	Presenter
9:00	UltraFLEX & x750 トラック 開会		
9:05	テスト開発を容易化するサイト変数と、PACEアーキテクチャによる高スループットの実現	UltraFLEXplus	秋元 一志
9:35	休憩		
9:40	TDR法による5Gミリ波DIBの性能評価	UltraFLEXファミリー	夕比ブ サイエッド
10:10	休憩		
10:15	イメージセンサ・プロトコル 2022アップデート	IP750	入来院 直彦
10:45	休憩		
10:50	UltraFLEXplus テストセル・ソリューション	UltraFLEXplus	小村 泰久
11:20	UltraFLEX & x750 トラック 閉会		

Day2 2022年12月7日 (水) 13:00-15:25 ETS トラック

Start Time	Title	Platform	Presenter
13:00	ETS トラック 開会		
13:05	ディスクリット・ウェハーテストの多個測化パッケージ	ETS-88 DUO	本田 学
13:35	休憩		
13:40	HCU-2000による、大電流DCテストと最適化手法	ETS-88-TH-DUO	井上 和聡
14:10	休憩		
14:15	BMSおよびPOLデバイステストのためのQMS測定精度の向上	ETS-800	友松 耕二
14:45	休憩		
14:50	テスト開発の生産性を高める EV-MST Productivity Tools 2022	ETS-800	畠中 耕司
15:20	ETS トラック 閉会		